



DataRay Inc.

ビームプロファイル測定システム

USB2.0
対応

DataRay社(米国 カリフォルニア州)はWindows™用のビームプロファイリングソフトウェアを最も早くリリースし、さらに14bitADCメガピクセルプロファイラーも最初に開発するなど、常に新しいビームプロファイル測定システムを提案しつづけている先進技術企業です。分解能に優れるスリットスキャンタイプからパルスレーザに適したCCDタイプまで幅広くラインナップを取り揃えており、各種光学関連部品の品質管理にご利用頂けます。レンズから出射されたレーザなどのプロファイル測定することにより、フォーカス位置、ビーム位置安定性、ビーム拡がり角、ビーム品質(M²)を知ることができます。また最新OS、Windows™ 7にも対応(無償アップグレード可)。

小型CMOS/CCDタイプ

カメラシステムで1/e²、FWHMのビームサイズを測定可能。最大ビーム径、最小ビーム径、ビーム楕円率、オリエンテーションも同時測定。USB2.0バスパワー駆動対応。



WinCam Dシリーズ (CCD)



超小型BladeCamシリーズ (CMOS)

NEW

測定波長範囲	1~350nm、350~1150nm 350~1330nm、1480~1680nm ※UV、IR領域では要コンバーター
測定ビーム径	6.3×5.3mm (最大サイズ) 47μm (最小径)
イメージエリア	CCD 6.5×4.8mm CMOS 6.6×5.3mm
ヘッドサイズ	WinCamDシリーズ 61×57×28mm BladeCam 45×45×16.5mm
オプション	M ² DUステージ ※装着時にM ² が測定可能となります。Taper装着時のイメージエリアは最大20×15mm

回転スリットスキャンタイプ

Dual / Single Detector

NEW

奥行き方向に4枚のディテクターを配置することにより、ビーム品質(M²)、ビーム拡がり角も同時測定。SiディテクターとInGaAsディテクターを2つ搭載した広波長範囲対応モデルも用意しております。どちらか1つのディテクターのみでもご用意できます。USB2.0/バスパワー駆動対応。



Dual Detectors Type

測定波長範囲	0.8~25μm ※ディテクターに準ずる (SiもしくはInGaAs Detector)
測定ビーム径	0.5μm~4mm (X軸-Y軸プロファイル、もしくはX軸-Y軸-Z軸プロファイル)

リニアスリットスキャンタイプ

リニアスリットスキャンタイプで1/e²、FWHMのビームサイズを測定可能。M²DUステージと本体の組み合わせにより最大45×23mm以下のビーム径の測定可能。楕円形ビームの測定も可能。



X-Yスリット

測定波長範囲	190nm~1100nm、800nm~1800nm、 1000nm~2400nm ※ディテクターに準ずる (SiもしくはGeディテクター)
測定ビーム径	0.5μm~25mm (X軸-Y軸プロファイル)
オプション	M ² DUステージ ※装着時にM ² が測定可能となります。



光技術をサポートする
株式会社オプトサイエンス

<http://www.optoscience.com>

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1番地 内藤町ビルディング
TEL:03(3356)1064 FAX:03(3356)3466 E-mail:info@optoscience.com
大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪ビル西館
TEL:06(6305)2064 FAX:06(6305)1030 E-mail:osk@optoscience.com
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-37-21 東海ソフトビル
TEL:052(569)6064 FAX:052(569)8064 E-mail:ngo@optoscience.com